

第45回 X線分析討論会

依頼講演者

高橋嘉夫 (広島大学)

「X線吸収微細構造法による分子地球化学の発展」

上殿明良 (筑波大学)

「陽電子消滅法を用いた材料解析 — 材料不良解析への応用 —」

野中敬正 (株)豊田中央研究所

「電池関連材料のX線分析」

井手亜里 (京都大学)

「複合材料分析の文化遺産研究への応用」

浅田賞受賞講演

保倉明子 (東京電機大学)

「微小部X線分析法のフアイトレメディエーション用植物への応用」



討論主題

- (1) X線吸収分光および軟X線分析
- (2) X線元素イメージングおよび関連技術
- (3) 表面X線分析 (EPMA, XPS, TXRF など)
- (4) X線・放射線分析による材料不良解析
- (5) その他、X線を利用した分析一般
(鑑識X線分析、環境X線分析なども含む)

会期 2009年11月5日(木)・6日(金)

会場 大阪市立大学 杉本キャンパス 学術情報総合センター 大阪市住吉区杉本3-3-138

交通 JR阪和線杉本町駅より徒歩5分・大阪市営地下鉄御堂筋線あびこ駅より徒歩20分またはタクシーにて5分

ミキサー 11月5日(木)大阪市立大学 学術情報総合センター

参加登録料 ●事前申込4,500円〔10月23日(金)まで〕

●一般当日6,000円 学生2,000円 ●ミキサー参加費1,000円

参加申し込み・問合せ先

辻 幸一 大阪市立大学大学院工学研究科

〒558-8585 大阪市住吉区杉本3-3-138 TEL:06-6605-3080 E-mail:tsuji@a-chem.eng.osaka-cu.ac.jp